<u>プログラム名: 核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化</u> <u>PM 名: 藤田 玲子</u> <u>プロジェクト名: 分離回収技術開発</u>

委託研究開発

実施状況報告書(成果)

平成28年度

研究開発課題名:

溶融塩中における電解還元・化学還元を用いたガラス固化体からの LLFP 回 収プロセスの開発(1)

研究開発機関名:

国立大学法人京都大学

研究開発責任者

エネルギー理工学研究所 教授 野平 俊之

I 当該年度における計画と成果

1. 当該年度の担当研究開発課題の目標と計画

ガラス固化体中の LLFP を回収可能な状態とするために、溶融塩電解法によるガラス還元技術の 開発を行う。溶融 CaCl₂中において、LLFP 含有ガラスを用いて電気化学測定を行い、電位と還元 反応の関係を明らかにする。また、LLFP 含有ガラスを用いて電解還元試験を行い、還元進行度や 反応メカニズムを検討する。ガラスの主成分である SiO₂について還元率 90%以上の達成を目標と する。

2. 当該年度の担当研究開発課題の進捗状況と成果

2-1 進捗状況

ガラス固化体とほぼ同じガラス成分を有する模擬ガラス(SiO₂:55.4%、B₂O₃:16.8%、Na₂O:11.4%、Al₂O₃:2%、Cao:3.5%、ZnO:3.5%、Li₂O:3.5%)、および、これに LLFP 成分(ZrO₂:1.5%、Cs₂O:1.0%、PdO:0.5%、SeO₂:0.1%)を含む LLFP 含有ガラスを用いて検討を行った。溶融 CaCl₂ 中における模擬ガラスの電解還元に先立ち、熱力学的検討(電位-*p*O²-図の作成)を行った。

熱力学的検討結果を踏まえ、溶融 CaCl₂中、1103 K において、模擬ガラスおよび LLFP 含有ガ ラスの電解還元に関して、サイクリックボルタンメトリーを用いて電位と還元反応の対応を調べた。 また、定電位電解により作製した電解還元サンプルを、XRD、SEM/EDX、ICP-AES 等を用いて 分析し、還元進行度や反応メカニズムを検討した。

2-2 成果

種々の熱力学データを用いて、溶融 CaCl₂系(1123 K)における種々の元素(Si、B、Al、Zr、Cs、Pd、Se)に関する電位 $-pO^2$ ·図を作成した。まず、Si については、SiO₂/CaSiO₃/Si 三相境界の電位 が 1.32 V (vs. Ca²⁺/Ca)であることが分かった。すなわち、これより卑な電位における電解 によっ て SiO₂が Si に還元される可能性がある。次に、B については、同様の B₂O₃/CaB₄O₇/B 三相境界

の電位が 1.58 V であり、上記の Si に関する三 相境界の電位 1.32 V よりも貴であることが分か った。すなわち、 B_2O_3 の還元は SiO₂ の還元よ りも貴な電位から開始することが予想される。 次に、Al については、上記と同様の Al₂O₃/CaAl₄O₇/Al 三相境界の電位は 0.68 V であ り、Si 系と比べてかなり卑であることが分かっ た。すなわち、SiO₂ が還元されても Al₂O₃ は未 還元である電位領域がかなり広いことを示唆し ている。続いて、LLFP 四元素の挙動に着いて 述べる。Zr に関しては、 $ZrO_2/CaZrO_3/Zr$ 三相 境界の電位は約 0.6 V であり、Al よりもさらに 還元されにくいことが分かった。Cs については、



図1 溶融 CaCl₂中(1103 K)における模擬ガラス封入 型電極のサイクリックボルタモグラム.電位走査速 度:100 mV s⁻¹.

ほぼ全領域にわたって CsCl の形態が安定であることが示されたため、ガラス中の Cs₂O 成分は溶 融 CaCl₂ と反応して浴中へ溶出すると予想される。Se に関しては、約 2.0 V より卑な電位領域にお いて CaSe が安定であることが分かった。すなわち、溶融塩中において LLFP 含有ガラスの電解還 元を行うと、Se²⁻イオンとして溶融塩中に溶出することが示唆された。

実験的検討の成果として、図1に1103 K の溶融 CaCl₂中において、模擬ガラス封入型電極を用 いて連続5回サイクルさせたサイクリックボルタモグラムを示す。なお、LLFP 含有ガラスの場合 もほぼ同様のサイクリックボルタモグラムが得られた。サイクルとともに還元電流が大きくなって おり、ガラスが還元されて実効電極表面積が大きくなっていることを示唆している。1.5 V 付近の 還元電流ピーク(C1)とそれに対応する酸化電流ピーク(A1)は、それぞれ B₂O₃ の還元と再酸化に対 応する可能性がある。また、0.5 V 付近から立ち上がる還元電流(C2)とそれに対応する酸化電流ピ ーク(A2)は、それぞれ Ca-Si 合金の形成と合金からの Ca 溶出に対応すると考えられる。

次に、図2に、LLFP含有ガラスを入れた小型るつぼ電極を定電位電解した後の断面写真を示す。

0.6 V および 0.8 V では、ガラス全体が還元 され黒茶色に変化している様子が分かる。 一方、1.4 V ではほとんど変化が見られず、 還元速度が非常に遅いと考えられる。

図3に、LLFP含有ガラスを0.9 Vで2 時間電解還元した後の試料のSEM像を示 す。ワイヤー状の還元生成物は、EDX分析 およびXRD分析により、Siであることを確 認した。さらに、EDX分析により、図中の ポイント①および②のSiO2還元率(重量ベ ース)を求めたところ、それぞれ95%および 92%であることが分かった。他の領域につ いてもSiO2還元率は平均90%以上であるこ とを確認したため、目標を達成した。

さらに、ICP-AES および ICP-MS により、 電解還元時の LLFP 成分の挙動を検討した。 その結果、Zr と Pd は固体中に残存し、Cs と Se は溶融塩中に溶出することが分かった。 これらの挙動は、電位 $-pO^{2-}$ 図から予想さ れたものと一致する。 0.6 V 0.8 V 1.4 V

図 2 溶融 CaCl₂中(1103 K)における定電位電解後の小型 るつぼ電極の断面写真. ガラス:LLFP 含有ガラス. 電解 条件: 0.6 V、0.8 V、1.4 V (vs. Ca²⁺/Ca)、5 時間.



図 3 溶融 CaCl₂中(1123 K)において LLFP 含有ガラスを 電解還元した後の試料の SEM 像. 電解条件: 0.9 V (vs. Ca²⁺/Ca)、2 時間.

2-3 新たな課題など

特になし

3. アウトリーチ活動報告 特になし